

落札結果情報

- 1 調達件名
税関検査場におけるX線検査装置画像及びAWB管理における実証実験
- 2 調達方式
役務
- 3 契約方式
一般競争入札
- 4 落札決定日
令和4年9月2日
- 5 落札者の氏名（法人番号）及び住所
株式会社IHI検査計測（4010701000913）
東京都品川区南大井6-25-3
- 6 落札価格（税込み）
24,055,900円
- 7 入札公告日
令和4年7月1日
- 8 落札方式
最低価格